

讓不可見的變成可見

– 利用 ace 2 X visSWIR 面掃描相機

看見隱藏在表面之下的東西

短波紅外線 (SWIR) 相機可突破表面限制看見更多。無論是檢查安全功能、偵測充填高度、照亮複雜的結構或檢測隱藏的物體，Basler ace 2 X visSWIR 相機都能讓您近距離觀察人眼看不見的內容。



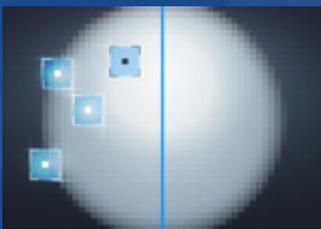
重點特色

- 外型精巧：29 mm x 29 mm
- 出色的影像品質：利用獨一無二的 Pixel Correction Beyond 功能動態校正畫素缺陷
- 先進的感光元件技術：採用 Sony SenSWIR 感光元件
- 光譜用途廣泛：可見光和不可見光譜皆可看見
- 整合容易：所需的元件全部集中一處，外加易於使用的 pylon 軟體

相機：ace 2 X visSWIR

相機型號	感光元件	解析度 (H×V 畫素)	解析度 (百萬畫素)	波長範圍	取像速度 (FPS)	介面	畫素尺寸 (μm ²)	光學尺寸
a2A2560-20gmSWIR	IMX992	2560 x 2048	5.2	0.4 - 1.7 μm	20	GigE, PoE	3.45 x 3.45	1/1.4"
a2A2560-70umSWIR	IMX992	2560 x 2048	5.2	0.4 - 1.7 μm	70	USB 3.0	3.45 x 3.45	1/1.4"
a2A2048-35gmSWIR	IMX993	2048 x 1536	3.1	0.4 - 1.7 μm	35	GigE, PoE	3.45 x 3.45	1/1.8"
a2A2048-110umSWIR	IMX993	2048 x 1536	3.1	0.4 - 1.7 μm	110	USB 3.0	3.45 x 3.45	1/1.8"
a2A1280-80gmSWIR	IMX990	1280 x 1024	1.3	0.4 - 1.7 μm	80	GigE, PoE	5 x 5	1/2"
a2A1280-125umSWIR	IMX990	1280 x 1024	1.3	0.4 - 1.7 μm	125	USB 3.0	5 x 5	1/2"
a2A640-240gmSWIR	IMX991	640 x 512	0.3	0.4 - 1.7 μm	240	GigE, PoE	5 x 5	1/4"
a2A640-240umSWIR	IMX991	640 x 512	0.3	0.4 - 1.7 μm	240	USB 3.0	5 x 5	1/4"

Pixel Correction Beyond



克服 InGaAs SWIR 成像中的畫素缺陷，
並建立與基於 TEC 的 SWIR 相機相符的影像品質。

更多資訊：baslerweb.com/zh-tw/cameras/ace2x-swir/beyond-features

適用於完整 visSWIR 視覺系統的配套產品



光源



濾光片



鏡頭



介面卡



配件



有關詳情，請參閱網頁：
baslerweb.com/zh-tw/cameras/ace2x-swir/



SWIR 是什麼？

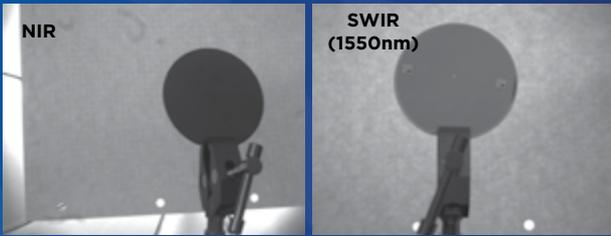
Basler ace 2 X visSWIR 相機
涵蓋 0.4-1.7 μm 的光譜範圍



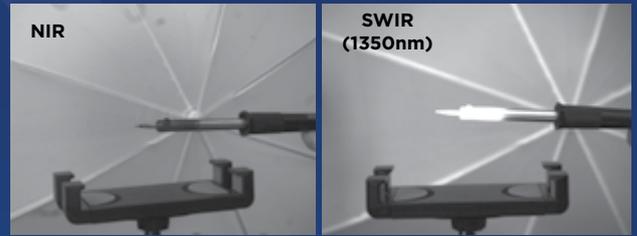
SWIR 代表短波紅外線，
用於 0.9 至 2.5 μm 之間的光譜範圍

SWIR 相機能做什麼？

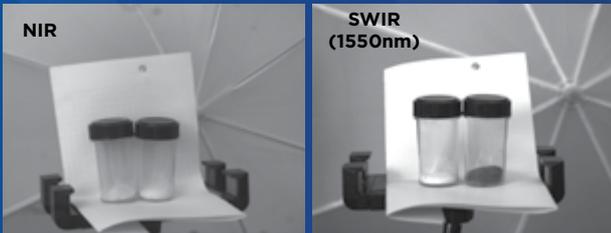
晶圓檢測



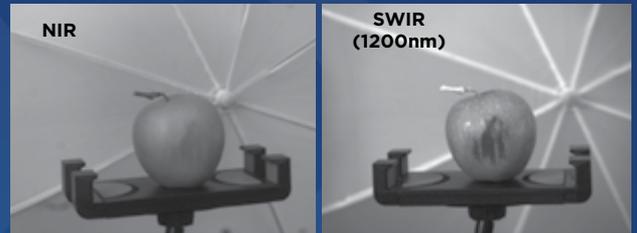
溫度檢測



物料分揀



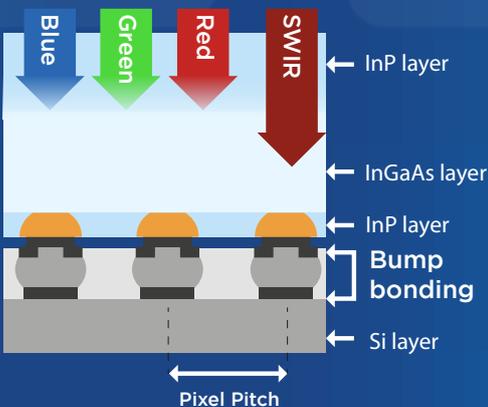
食品檢驗



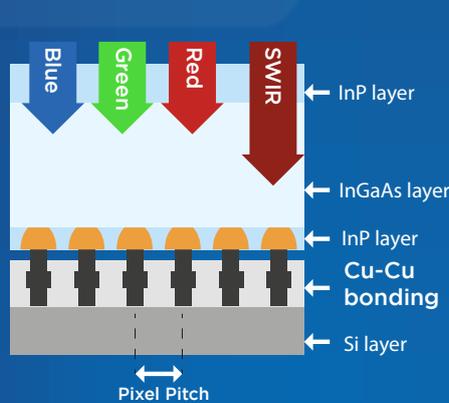
低成本 SWIR 技術，電腦視覺新前景

Sony SenSWIR 技術利用銅對銅互接，因此畫素比傳統 InGaAs 感光元件更小。這使相機能做到設計精巧、價格實惠。Basler 利用 SenSWIR 技術和視覺專業知識，透過獨特的相機內功能和整合硬體和軟體提供最佳的 SWIR 成像結果。

Bump bonding



Cu-Cu bonding



Basler AG
Germany, Headquarters
Tel. +49 4102 463 500
sales.europe@baslerweb.com

Basler Vision Technologies
Taiwan Inc. (Subsidiary)
Tel. +886 3558 3955
sales.asia@baslerweb.com

請造訪我們的網站，查詢所在地附近其他 Basler 營業據點和代表處
baslerweb.com/sales

BASLER
the power of sight